

Структурный анализ и диагностика материалов

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Язык обучения: **русский**

Форма обучения: **Очная**

Продолжительность: **2 года**

Возможность бесплатного обучения: **есть**

Стоимость: **245 400 рублей/год**

Куратор программы: **Савченко Александр Григорьевич**

Телефон: **+7 495 955-01-33**

E-mail: algsav@gmail.com

Программа ориентирована на научно-исследовательскую деятельность в области применения методов фазового и структурного анализа материалов различного назначения.

Работа магистрантов по данной программе осуществляется в лабораториях кафедры, Центре рентгеноструктурных исследований и диагностики материалов и Международной школе микроскопии, располагающими уникальным оборудованием (мёссбауэровский спектрометр типа MC1104Em с высокотемпературной приставкой, дифрактометр Rigaku SmartLab, рентгенофлуоресцентный спектрометр Primuz II, растровый электронный микроскоп JEOL JSM-6610L, просвечивающий электронный микроскоп JEM 1400).

Специализации в рамках данной программы

Магистр-инженер в области методов структурных исследований материалов